

DIN 50990:2018-12 (D)

Messung von Schichtdicken - Messung der flächenbezogenen Masse von metallischen Schichten mittels spektrometrischer Messverfahren

Inhalt	Seite
Vorwort	4
1 Anwendungsbereich.....	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Einheiten	5
4 Kurzbeschreibung.....	5
5 Geräte und Reagenzien.....	6
5.1 Geräte.....	6
5.2 Reagenzien	6
6 Einflüsse auf das Messergebnis	7
6.1 Oberfläche.....	7
6.2 Messstelle.....	7
6.3 Fremdanteile in der Schicht.....	8
6.4 Chemisches Auflösen.....	8
6.5 Anodisches Auflösen	8
6.6 Grundwerkstoff.....	8
6.7 Störungen der Messungen	8
7 Durchführung	9
7.1 Probenvorbereitung.....	9
7.2 Herstellen der Lösungen.....	9
7.2.1 Allgemeines.....	9
7.2.2 Probenlösungen.....	9
7.2.3 Blindwertlösung	9
7.2.4 Bezugslösungen	9
7.3 Bezugsfunktion	10
7.4 Durchführung der Messungen.....	11
8 Auswertung	12
9 Messunsicherheit	13
10 Prüfbericht	14
Anhang A (informativ) Beispiele für Ablöseflüssigkeiten	15
Literaturhinweise	17
Tabellen	
Tabelle 1 — Geeignete Wellenlängen zur AAS — Analyse metallhaltiger Lösungen	10
Tabelle 2 — Geeignete Wellenlängen zur ICP — Analyse metallhaltiger Lösungen [4]	11
Tabelle 3 — Dichte des Volumenmaterials.....	13
Tabelle A.1 — Beispiele für Ablöseflüssigkeiten.....	15